

Список публикаций официального оппонента д.ф.-м.н. **Егорова Н.В.** по теме диссертации Филиппова С.В. «Разработка методов определения основных эмиссионных параметров наноструктурированных полевых эмиттеров»:

1. Egorov N.V., Antonov A.Yu., Demchenko N.S. Statistical Simulation of Energy Spectra of Field Emission Electrons // *Technical Physics*. – 2017. – Т. 62. – № 2. – С. 201-207.
2. Egorov N.V., Gileva A.Yu., Antonova L.I., Trofimov V.V., Karpov A.G. Study of Optimum Conditions of a Vacuum Holographic Microscope // *Journal of Surface Investigation X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques*. – 2017. – Т. 11. – №. 2. – С. 449-451.
3. Fursey G.N., Egorov N.V., Zakirov I.I., Yafyasov A.M., Antonova L.I., Trofimov V.V. Peculiarities of the total energy distribution of field emission electrons from graphene-like structures // *Journal of Communications Technology and Electronics*. – 2016. – Т. 61. – №. 1. – С. 72-75.
4. Egorov N.V., Antonova L.I., Karpov A.G., Trofimov V.V., Fedorov A.G. Theoretical and Experimental Evaluation of the Electrical Parameters of a Holographic Microscope // *Journal of Surface Investigation*. – 2020. – Т. 14. – №. 5. – С. 1061-10653.
5. Vinogradova E.M., Doronin G.G., Egorov N.V. Mathematical Simulation of a 2D Diode System with a Blade-Shaped Field Emitter // *Technical Physics*. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 514-517.
6. Egorov N.V., Antonova L.I., Trofimov V.V., Gileva A.Y. Atomic Structure Probing of Thin Metal Films via Vacuum Holographic Microscopy // *Journal of Surface Investigation*. – 2019. – Т. 13. – №. 6. – С. 1267-1271.
7. Egorov N.V., Karpov A.G., Klemeshev V.A. Identification of Field-Emission Images as “Spotty Pictures” // *Journal of Surface Investigation*. – 2018. – Т. 12. – №. 6. – С. 1200-1205.
8. Egorov N.V., Antonov A.Y., Varayun M.I. Analysis of the Emission Characteristics of Field Cathodes Using Regression Models // *Journal of Surface Investigation*. – 2018. – Т. 12. – №. 5. – С. 1005-1012.
9. Book Chapter/ Carbon-based field emitters: Properties and applications Egorov, N.V., Sheshin, E.P. *Topics in Applied Physics, Springer Series in Advanced Microelectronics* 2020, 135, P. 449-528
10. Egorov N.V., Sheshin E.P. On the current state of field-emission electronics // *Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*. – 2017. – Т. 11. – С. 285–294. doi: 10.1134/S1027451017020082.

11. Egorov N.V., Shehin E.P. Field Emission Electronics. – New York: Springer, 2017. – 578 p.
12. Егоров Н.В., Никифоров К.А. Некоторые проблемы моделирования систем на основе автоэлектронной эмиссии. – СПб: ВВМ, 2015. – 145 с.
13. Егоров Н.В., Е.П. Шешин Автоэлектронная эмиссия. Принципы и приборы. Интеллект, 2011. 704 с.